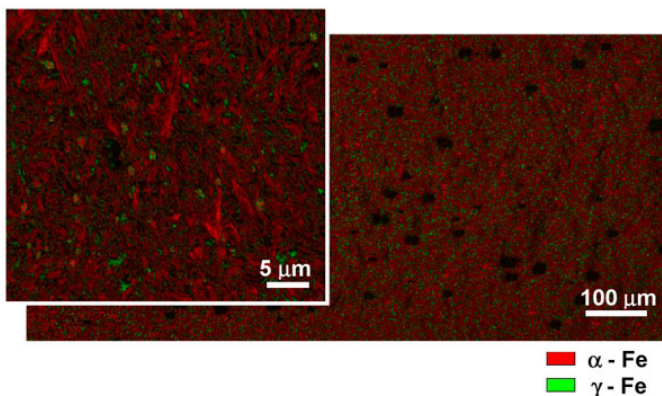




物理解析技術による各種材料評価

先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズに必ずお応えします。

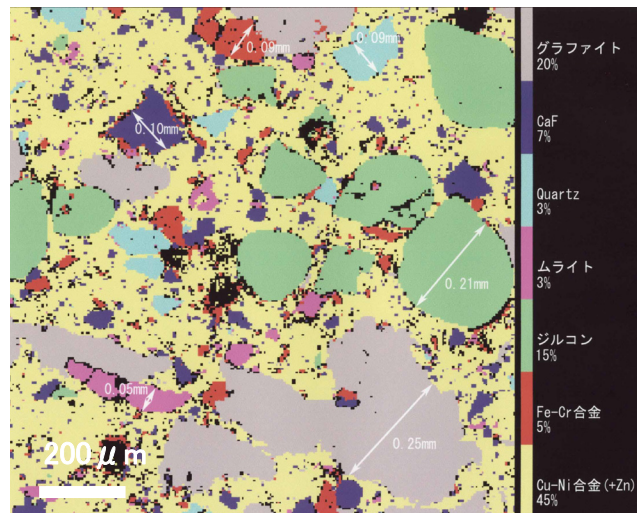
SEM-EBSD法による残留オーステナイト分布



● 残留オーステナイト層分布測定例

SEM(走査電子顕微鏡)に組み合わせたEBSD(後方散乱電子回折法)により、鋼中の結晶構造の異なる二相(マルテンサイト相とオーステナイト相)の分布を測定した例。測定が困難であったオーステナイト量としての定量化も可能。

EPMA-μ XRD法による微細構造調査



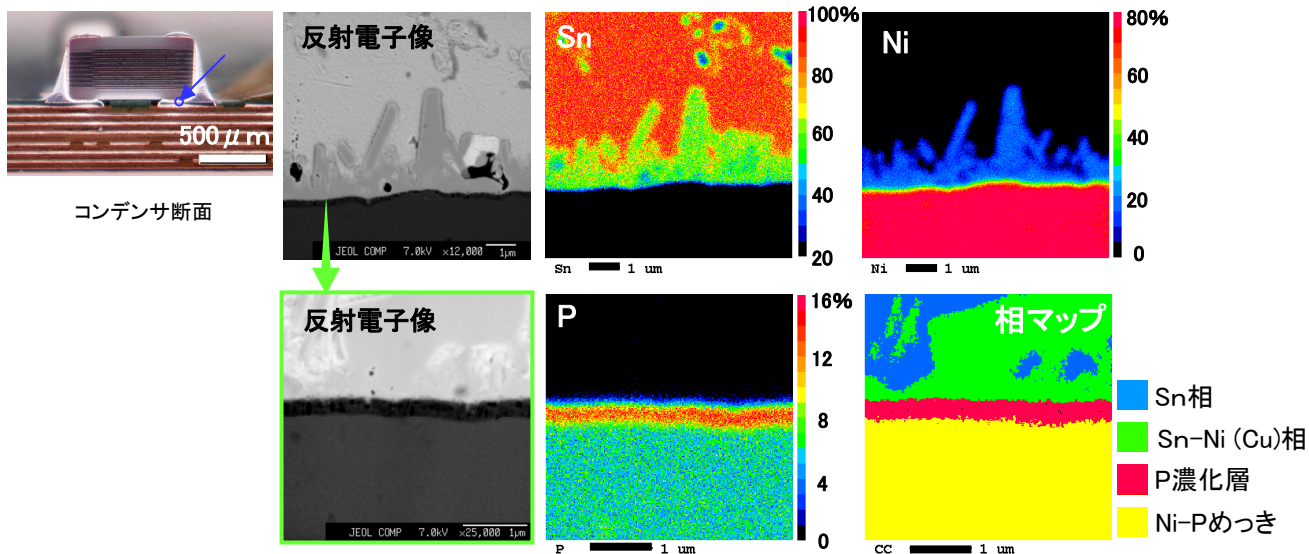
● ブレーキパッドの構造解析例

EPMA(電子プローブマイクロ分析)とμ-XRD(微小部X線回折法)の測定により、成分分布だけでなく、構成する結晶構造の分布として解析した例。

FE-EPMAによる界面構造調査

● コンデンサ接続部のPbフリーはんだ /NiPめっき断面の観察例

Sn-Ni(Cu)の合金相(柱状結晶)と、Ni-Pめっきの表面に約300nm厚さのPの濃化層を確認した。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2010 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved. 本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。